

導入年度	H 2 5 年度	設備名	電子機器寿命評価試験機		
メーカー	楠本化成(株)	型式	NT1231W	設置室	環境試験室

平成 25 年度 電源地域産業関連施設等整備費補助事業

### 《 概 要 》

本装置は電子機器や部品を設置したテストエリアに、高温(200℃以下)室または低温(-65℃以上)室から送風することで、テストエリア内の温度を急激(数分以内)に変え、供試体に繰り返し熱ストレスを加えることで信頼性を評価することができます。また、高温さらし中に通電し試験品を動作させることができるほか、故障診断のための2端子間の抵抗変化をモニタリングすることにより、評価時間を短縮することができます。

### 《 装置構成 》



### 《 仕様 》

- ①本体
  - 1) 試験槽容量 : W650 × D400 × H500mm (130ℓ)
  - 2) 高温さらし温度範囲 : 60 ~ 200℃
  - 3) 低温さらし温度範囲 : -65 ~ 0℃
  - 4) 温湿度復帰性能 : 4分以内  
(常温→150℃及び常温→-65℃、プラスチックモールド IC 5kg)
- ②供試体用電源
  - 1) 電圧 : AC 0~300V、DC 0~±400V
  - 2) 電力 : 1kVA
- ③抵抗計測システム
  - 1) DC 抵抗 : 0.1mΩ ~ 1MΩ
  - 2) AC 抵抗 : 0.1μΩ ~ 2kΩ
  - 3) 測定点数 : 32ch

### 《 用途例 》

- ・ 高温さらし中に供試体に通電し、発熱部品が過酷な条件(右図参照)となる加速試験
- ・ 熱サイクル中の接点抵抗の計測による、電子部品のはんだ接合で生じるクラックや割れなどの早期発見
- ・ 樹脂成型品の熱歪みによる割れの確認
- ・ 樹脂+インサートナットなどのような異種材料の組合せ成型品の耐久性評価

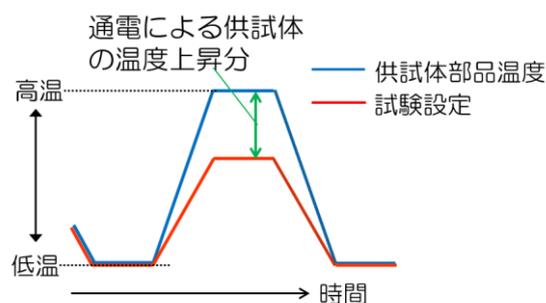


図 熱サイクルの例